Tl_{0.33}WO₃电子结构和太阳辐射 屏蔽性能第一性原理研究*

秦京运1) 舒群威1) 袁艺1) 仇伟1) 肖立华1)† 彭平2) 卢国松1)

(贵州理工学院,贵阳 550003)
 (湖南大学材料科学与工程学院,长沙 410082)
 (2019年10月16日收到:2019年12月16日收到修改稿)

节能减排已成为当今社会发展的主题,对节约能源、提高太阳能的高效综合利用的新型窗用透明隔热材料的理论设计和研究尤其重要.本文采用基于密度泛函理论的计算方法,研究了六方相三氧化钨 TI 掺杂前、后的晶格参数、电子能带结构、形成能和光学性质.研究结果表明,TI 掺杂后晶格体积增大,系统能量降为负值,体系具有更好的稳定性;掺杂后电子能带结构发生很大的变化,但材料仍保持 n 型电导率;随之,其光学性质也发生改变,掺杂前 h-WO₃ 无近红外吸收性能,掺杂后的 Tl_{0.33}WO₃ 具有很强的近红外吸收性能.在此基础上研究了 TI 掺杂 h-WO₃ 前、后的太阳辐射屏蔽性能,掺杂前无太阳辐射屏蔽性能;掺杂后的 Tl_{0.33}WO₃ 薄膜具有可见光高透明、近红外屏蔽的性能.计算结果为 TI 掺杂 h-WO₃ 在窗用透明隔热材料方面的研究提供了理论依据.

关键词:第一性原理, Tl 掺杂, 六方相 WO₃, 光学性质 **PACS:** 71.15.Mb, 78.20.Ci, 78.30.-j, 78.40.-q

DOI: 10.7498/aps.69.20191577

1 引 言

在全球气候变暖的背景下,节能减排迫在眉睫,节能材料备受人们青睐.为了实现可见光高透明、近红外辐射强屏蔽,从而减少室内和车内空调的致冷负荷和汽车尾气的排放,达到节能减排的目的,新型环保高透明太阳辐射屏蔽材料的设计和研究迫在眉睫.

迄今为止,研究者相继开发了掺锑氧化锡 (ATO)^[1]、掺铟氧化锡 (ITO)^[2]、稀土六硼化物 (ReB₆)^[3,4]、氮化钛 (TiN)^[5]、二氧化钒 (VO₂)^[6]、钨 青铜类化合物 M_xWO₃^[7-15] (M=Tl, Na, K, Rb, Cs; 0 < x ≤ 0.33) 等透明隔热窗用近红外吸收材 料, 但上述材料各有其优缺点. 纳米 ATO^[1] 只能屏 蔽光波长 1500—2500 nm 的近红外辐射, 纳米 ITO^[2] 只能屏蔽光波长 1200—2500 nm 的近红外 辐射, 但对光波长 780—1200 nm 的高能近红外辐 射无能为力. 氮化钛^[5] 是非计量化合物, 它的组成 范围为 TiN_{0.6}—TiN_{1.16}, 但其光学性能受 N/Ti 比 率的影响很大. 纳米 VO₂^[6] 虽然存在从高温金属相 到低温绝缘体相的转换特性可用于智能温控窗, 但 其透明隔热性能较差, 无法达到高性能窗用透明隔 热材料的要求. 纳米六硼化物 ReB₆, 特别是 LaB₆, 虽然可屏蔽掉光波长 780—1300 nm 的高能近红 外辐射^[3,4], 但对光波长 1300 nm 以上的近红外辐

© 2020 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 61751501, 51776046)、贵州省科技计划项目 (批准号: 黔科合支撑 [2019] 2830, 黔科合基础 [2019] 1133)、贵州省教育厅青年科技人才成长项目 (批准号: 黔教合 KY 字 [2018] 250) 和国家大学生创新创业训练计划项目 (批准号: 201714440023) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: xiaolihua@git.edu.cn

射屏蔽性能较差. 在诸如此类透明隔热窗用近红外 吸收材料中,由于 M_xWO₃ 具有其它材料无法比拟 的可见光高透明、近红外辐射强吸收屏蔽性能,研 究者对金属离子掺杂六方相三氧化钨 (M_aWO₃) 的透明隔热性能进行了大量的实验研究[7-15],而理 论研究较少. Yang 等^[16,17] 采用 HSE 杂化密度泛 函计算了碱金属单掺杂和共掺杂六方相三氧化钨 的电子结构和光学性质,但掺杂含量太低(0.083%), 远少于实验掺杂含量 (0.15%— 0.33%); Lee 等^[18] 也采用 HSE 杂化密度泛函计算了 Na_{0.33}WO₃ 和 K_{0.33}WO₃的光学性质,但与实验值相差甚远; Yoshio 和 Adachi^[19] 采用密度泛函理论 (DFT)+ U方法研究了铯掺杂六方相三氧化钨的光学性质. Xu等^[20]采用广义密度梯度近似 (GGA) 研究了 Cs0.33WO3的光学性质,理论研究结果与实验结果 基本一致.

鉴于实验报道 Tl 掺杂 h-WO₃ 形成的 Tl_{0.33}WO₃ 也具有太阳辐射屏蔽性能^[7], 但其理论研究鲜有报 道.因此,本文采用 DFT-GGA 方法对 Tl_{0.33}WO₃ 的能带结构、形成能、态密度和光学性质进行理论 研究,在此基础上预测其太阳辐射屏蔽性能.

2 晶体结构和计算方法

2.1 晶体结构

六方相三氧化钨 (h-WO₃) 属于六方晶系, 空间群为 *P6/mmm* (No. 191), 具有 WO₆ 氧八面体 六元环和三元环的 *ab* 平面内的沿 *c* 轴堆积, 形成 平行 *c* 轴的六边形和三边形的准一维孔道^[21]. 六方 相三氧化钨中 W 原子位于 (0.5, 0, 0), O 原子位 于 (0.5, 0, 0.5) 和 (0.212, 0.424, 0). Tl 离子嵌入 在 WO₆ 八面体六元环内, 位置为 (0, 0, 0)^[22] (如图 1 所示).

2.2 计算方法

本文所进行的第一性原理计算是采用基于密 度泛函理论的 CASTEP 软件^[23]. 计算首先采用 BFGS 算法对六方相三氧化物 (h-WO₃) 的晶体结 构进行几何结构优化, 然后建立 2 × 2 × 1 的超晶 胞, 几何结构优化后, Tl 原子掺杂在 WO₆ 八面体 六元环内, 构成 Tl_{0.33}WO₃ 晶体结构. 在对其进行 几何结构优化得到稳定晶体体系的基础上, 进行能



图 1 Tl 掺杂 h-WO₃ 的 2 × 2 × 1 超晶胞俯视图 Fig. 1. Top view of the 2 × 2 × 1 supercell of Tl-doped h-WO₃.

带结构、态密度和光学性质的计算.交换关联势采 用广义梯度近似 (GGA)^[24]中的 PBE^[25]提出的形 式,描述离子实与价电子之间的相互作用势采用超 软赝势进行.计算中 Tl,W和O各原子的电子价 态分别为 6s²6p¹, 5p⁶5d⁴6s², 2s²p⁴,其它轨道电子 作为芯电子进行计算.平面波截止能和布里渊区 *k*点的设置分别为 500 eV和9×9×15.迭代过 程中的自洽收敛精度为 5.0×10⁻⁶ eV/atom,晶体 内应力收敛标准为 0.02 GPa,最大位移为 5.0× 10⁻⁴ Å以及原子间相互作用力收敛标准为小于 0.01 eV/Å.h-WO₃ 的电子能带结构和光学性质计 算均采用了剪刀算符修正带隙值.h-WO₃ 的带隙 计算值为 0.62 eV, 而实验值为 2.6—3.25 eV^[26–29], 因此,剪刀算符设为 2.0 eV.

3 计算结果与讨论

3.1 几何结构优化结果

表1为采用基于第一性原理的广义密度梯度 近似方法,对h-WO₃和Tl_{0.33}WO₃的进行结构优 化及能带结构计算得到的晶格参数和能带间隙.其 中,Tl_{0.33}WO₃的晶格参数为Tl空位掺杂六方相 三氧化钨(h-WO₃)的超晶胞结构几何优化后,折 合成单晶胞的结构参数.计算得到的纯h-WO₃的 晶格参数和带隙值的计算误差均小于2.0%,与实 验和理论值基本一致.Tl掺杂后晶格体积比纯h-WO₃晶体稍有增大,这主要是六元环的半径为 0.163 nm^[30],而Tl的离子半径为0.184 nm^[31],当 嵌入的离子半径大于六元环的半径时,造成晶格畸 变,从而使晶格体积增大.

Table 1. Lattice parameters, band gap and formation energy of pure $h-WO_3$ before and after TI-doped.					
	$a/{ m \AA}$	$b/{ m \AA}$	$c/\text{\AA}$	$E_{\rm g}/{\rm eV}$	$E_{\rm f}/{ m eV}$
h-WO ₃ (Expt.)	$7.298^{[1]}$	$7.298^{[1]}$	$3.899^{[32]}$		
$\mathrm{h\text{-}WO}_3 \; (\mathrm{Calc.})$	7.4403	7.4403	3.8240	0.62	
	$7.438^{[2]}$	$7.438^{[2]}$	$3.827^{[33]}$	0.66	
$Tl_{0.33}WO_3(Calc.)$	7.4673	7.4673	3.8220	0	-2.359

表 1 Tl 掺杂六方相 WO₃ 前、后的晶格参数、带隙与形成能 Fable 1. Lattice parameters, band gap and formation energy of pure h-WO₃ before and after Tl-doped.

3.2 形成能分析

通过计算 Tl 掺杂纯 h-WO₃ 的形成能可分析 其相对稳定性^[34,35], 计算公式为

$$E_{\rm f} = E_{\rm doped} - E_{\rm pure} - n\mu_{\rm Tl}$$

其中 E_{doped} 和 E_{pure} 分别表示空位掺杂模型与纯 h-WO₃ 超胞模型的总能量; μ_{Tl} 为 Tl 原子的化学势; n 为掺杂进入纯 h-WO₃ 的 Tl 原子的个数. 形成能的计算结果列于表 1. 结果表明, Tl 空位掺杂纯 h-WO₃ 的形成能为-2.359 eV, 负的形成能表明 Tl 空位掺杂纯 h-WO₃ 体系具有良好的稳定性.

3.3 能带结构和态密度分析

3.3.1 纯 h-WO₃ 能带结构和态密度分析 为方便比较和分析空位掺杂对纯 h-WO₃ 能带 结构和态密度的影响, 先计算了纯 h-WO₃ 的能带 结构和态密度如图 2 所示. 从图 2(a) 的能带结构 计算结果可知, 纯 h-WO₃ 带隙较大, 导带底和价 带顶分别位于 Brillouin 区高对称点 Γ和点 A 处, 为间接带隙半导体. 其间接带隙计算值为 0.62 eV, 经剪刀算符 2.0 eV 修剪后间接带隙值为 2.62 eV. 由图 2 纯 h-WO₃ 的总态密度可知, 价带和价带顶 态密度则主要由 O-2p 组成, 导带和导带底的态密 度主要是 W-5d 态构成. 从分态密度可知, 纯 h-WO₃ 的价带和导带都主要由局域化的 O-2p 和 W-5d 轨 道电子构成并发生杂化, 表明 O 原子与 W 原子之间 共价键比较明显, 这一特性与文献的计算结果一致.

3.3.2 Tl_{0.33}WO₃能带结构和态密度分析

Tl 空位掺杂 h-WO3 能带结构和态密度如图 3



图 2 纯 h-WO₃ 的能带结构和态密度: (a)能带结构; (b) 总态密度; (c) W 的分态密度; (d) O1 的态密度; (e) O2 的分态密度 Fig. 2. Energy band structure and DOS of pure h-WO₃: (a) Energy band structure; (b) TDOS of h-WO3; (c) PDOS of W; (d) PDOS of O1; (e) PDOS of O2.



图 3 Tl 掺杂 h-WO₃(Tl_{0.33}WO₃)能带结构和态密度: (a)能带结构; (b) 总态密度; (c) Tl 的分态密度; (d) W 的分态密度; (e) O1 的态密度; (f) O2 的分态密度

Fig. 3. Energy band structure and DOS of $Tl_{0.33}WO_3$: (a) Energy band structure; (b) TDOS of $Tl_{0.33}WO_3$; (c) PDOS of Tl; (d) PDOS of W; (d) PDOS of O1; (e) PDOS of O2.

所示.对比图 3 与图 2 的分态密度可知, Tl_{0.33}WO₃ 价带主要由 O-2p、W-5d 和 Tl-6s 态组成, 导带主 要 W-5d 和 Tl-6p 态组成, 尤为重要的是 W-5d 越 过费米能级 *E*_F 进入价带, 价带顶和导带底均由 W-5d 态构成.这表明 Tl 掺杂 h-WO₃ 主要扮演着 捐献电子的角色. 从图 3(a) 可知, 价带顶和导带底 的位置没有改变; 但价带整体下移, 导带底越过费 米能级 *E*_F 形成简并态, 并且导带和价带之间仍存 在一定的间隙, 这表明 Tl 空位掺杂构成的 Tl_{0.33}WO₃ 晶体仍保持 n 型电导率. h-WO₃ 掺杂前 后费米能级的变化表明晶体从半导体向导体转变, 这必将导致材料的光学性质的改变^[36,37]. 后文中的 光学性质的计算结果将进一步印证这一结论.

3.4 光学性质

为研究 Tl 掺杂前后 h-WO₃ 的光学性质, 对 Tl 空位掺杂前后六方相 h-WO₃ 的介电函数进行 了计算研究. 在计算 h-WO₃ 的光学性质时, 首先 采用剪刀算符对其电子结构进行了修正, 计算光学 性质时也采用相同剪刀算符进行修正, 本文 h-WO₃ 的电子结构和光学性质计算的剪刀算符取值 为 2.0 eV. 介电函数表达式为 $\varepsilon(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega), 相关计算公式如下^[38]:$

$$\varepsilon_{2} = \frac{\pi}{\varepsilon_{0}} \left(\frac{e}{m\omega}\right)^{2} \cdot \sum_{\mathrm{V},\mathrm{C}} \left\{ \int_{\mathrm{BZ}} \frac{2\mathrm{d}\boldsymbol{K}}{\left(2\pi\right)^{3}} |\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{M}_{\mathrm{C},\mathrm{V}}(\boldsymbol{K})|^{2} \delta\left[E_{\mathrm{C}}(\boldsymbol{K}) - E_{\mathrm{V}}(K) - \hbar\omega\right] \right\},\tag{1}$$

$$\varepsilon_{1} = 1 + \frac{2e}{\varepsilon_{0}m^{2}} \cdot \sum_{\mathbf{V},\mathbf{C}} \int_{\mathbf{BZ}} \frac{2\mathbf{d}\boldsymbol{K}}{(2\pi)^{3}} \frac{|\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{M}_{\mathbf{C},\mathbf{V}}(\boldsymbol{K})|^{2}}{[E_{\mathbf{C}}(\boldsymbol{K}) - E_{\mathbf{V}}(\boldsymbol{K})]} \cdot \frac{\hbar^{3}}{[E_{\mathbf{C}}(\boldsymbol{K}) - E_{\mathbf{V}}(\boldsymbol{K})]^{2} - \hbar^{2}\omega^{2}},$$
(2)

式中, C, V 代表导带、价带; BZ 表示第一布里渊 区; \hbar 是狄拉克常量; K是倒格矢; $|a \cdot M_{C, V}(K)|^2$ 是动量矩阵元; $E_{C}(\mathbf{K})$, $E_{V}(\mathbf{K})$ 代表导带、价带本征能级.根据克拉默斯-克勒尼希 (Kramers-Kronig)

色散关系及电子跃迁概率的定义利用介电函数的 实部 $\varepsilon_1(\omega)$ 与虚部 $\varepsilon_2(\omega)$ 可推导出固体的反射率 $R(\omega)$ 和吸收系数 $\alpha(\omega)$.

图 4 (a) 为 Tl 掺杂 h-WO₃ 前后的介电函数虚 部 $\varepsilon_2(\omega)$,虚部与带间跃迁有关,取决于导带与价带 的跃迁,可通过能带结构与态密度解释.从图 4 (a) 可以看出, h-WO₃ 的介电函数阈能约为 2.6 eV,这 是 h-WO₃ 的基本吸收边,当光子能量高于此值时, 虚部曲线迅速上升.纯 h-WO₃ 的介电函数有两个 特征峰,峰 1 和峰 2 分别对应光子能量为 5.8 eV 和 11.4 eV.峰 1 对应 O-2p 态电子向 W-5d 态直 接跃迁所致;峰 2 是下价带能级电子向上导带能级 跃迁所致.Tl 原子空位掺杂后, Tl_{0.33}WO₃ 在低能 0.1 eV 处增加新的最大特征峰,这是价带顶 W-5d 态向导带底 W-5d 态跃迁所致,其它两个特征 峰向低能方向移动.

采用第一性原理计算出来的材料的反射谱 *R*(ω) 和吸收谱 α(ω) 代入公式^[39]:

$$T = \frac{(1-R)^2 \exp(-\alpha d)}{1-R^2 \exp(-2\alpha d)},$$
 (3)

(其中 d 为薄膜厚度)可计算材料致密薄膜和涂层 薄膜的太阳辐射屏蔽性能. 需要指出的是材料致密 薄膜的理论透光率是根据反射谱和吸收谱共同作 用计算出来的结果;材料涂层薄膜的理论透光率是 只根据吸收谱计算出来的结果,因为涂层薄膜的反 射率极低^[40]. 图 5 为 200 nm 厚 h-WO3 和 Tl_{0.33}WO3 薄膜的理论透过率. 从图 5(a) 中可以看出 h-WO3 致密薄膜对太阳辐射从紫外-可见光到近红外的辐 射屏蔽作用很弱;但其掺杂后 (Tlo 33 WO3) 对可见 光有很高的透光率,在光波长 711 nm 处最大透光 率为 61.9%; 而对近红外辐射有很强的屏蔽作用, 在光波长 1607 nm 处最小透光率为 2.0%, 两者差 值约为 60%. 从图 5(b) 中掺杂 h-WO3 前后涂层薄 膜的理论透过率可以看出, h-WO3涂层薄膜对太 阳辐射无屏蔽作用; 而掺杂后 Tl_{0.33}WO₃ 涂层的理 论透过率曲线呈"吊铃"型分布,在可见光



图 4 h-WO₃和 Tl_{0.33}WO₃的光学性质: (a) 介电函数虚部; (b) 反射谱; (c) 吸收谱

Fig. 4. Optical performance of h-WO₃ and $Tl_{0.33}WO_3$: (a) Imaginary part of the dielectric function; (b) reflectivity; (c) absorption spectrum.



图 5 h-WO₃和 Tl_{0.33}WO₃ 薄膜的理论透过率: (a) 致密薄膜; (b) 涂层薄膜

Fig. 5. Theoretical transmittance of h-WO₃ and $Tl_{0.33}WO_3$ films: (a) The compacted film; (b) the coated film.

678 nm 处透光率最大值可达 82.8%, 在近红外 1524 nm 处透光率最小值为 5.0%. 两者相差 77.8%. 从以上分析可以看出, h-WO₃ 掺杂前对太阳辐射 几乎无屏蔽作用, 而 Tl 掺杂后的 Tl_{0.33}WO₃ 无论 是致密薄膜还是涂层薄膜对太阳辐射均有很好的 可见光高透明、近红外强屏蔽作用. 涂层薄膜的理 论透光率与文献^[7] 实验结果基本一致.

4 结 论

本文采用第一性原理对 h-WO₃ 及掺杂后形成 的 Tl_{0.33}WO₃ 材料的晶格参数、形成能、电子结构 和光学性质进行了计算和分析,并预测了其薄膜的 理论透光率.计算结果表明:1) Tl 掺杂 h-WO₃ 后 晶格体积增大,系统能量为负值,晶体具有更好的 结构稳定性;2) Tl 掺杂半导体 h-WO₃ 后晶体能带 结构发生变化,构成的 Tl_{0.33}WO₃ 晶体保持 n 型电 导率;3) h-WO₃ 掺杂前无近红外吸收/反射性能, 而掺杂后形成的 Tl_{0.33}WO₃ 具有很强的近红外吸 收/反射性能,可用作可见光高透明、近红外强吸 收屏蔽的窗用透明隔热材料.

参考文献

- [1] Saito M 1997 Convertec 25 7
- [2] Muromachi T, Tsujino T, Kamitani K, Maeda K 2006 J. Sol-Gel Sci. Technol. 40 267
- [3] Xiao L H, Su Y C, Qiu W, Liu Y K, Ran J Y, Wu J M, Lu F H, Shao F, Tang D S, Peng P 2016 *Ceram. Int.* 42 14278
- [4] Xiao L H, Su Y C, Ran J Y, Liu Y K, Qiu W, Wu J M, Lu F
 H, Shao F, Tang D S, Peng P 2016 J. Appl. Phys. 119 164903
- [5] Xiao L H, Su Y C, Chen H Y, Liu S, Jiang M, Peng P, Liu S 2011 Appl. Phys. Lett. 99 061906
- [6] Xiao L H, Su Y C, Qiu W, Ran J Y, Liu Y K, Wu J M, Lu F H, Shao F, Peng P 2016 Appl. Phys. Lett. 109 193906
- [7] Takeda H, Adachi K 2007 J. Am. Ceram. Soc. 90 4059
- [8] Yao Y, Zhang L, Chen Z, Cao C, Gao Y, Luo H 2018 Ceram. Int. 44 13469
- [9] Mattox T M, Bergerud A, Agrawal A, Milliron D. J 2014 Chem. Mater. 26 1779
- [10] Guo C S, Yin S, Yan M., Sato T 2011 J. Mater. Chem 21 5099
- [11] Guo C S, Yin S, Sato T 2012 J. Am. Ceram. Soc. 95 1634
- [12] Guo C S, Yin S, Dong Q 2013 J. Nanosci. Nanotechnol. 13 3236
- [13] Adachi K, Asahi T 2012 J. Mater. Res. 27 965
- [14] Yu Z Y, Yao Y J, Yao J N, Zhang L M, Chen Z, Gao Y F,

Luo H J 2017 J. Mater. Chem. A 5 6019

- [15] Lee J S, Liu H C, Peng G D, Tseng Y 2017 J. Cryst. Growth 465 27
- [16] Yang C X, Chen J F, Zeng X F, Cheng D J, Cao D P 2014 Ind. Eng. Chem. Res. 53 17981
- [17] Yang C X, Chen J F, Zeng X F, Cheng D J, Huang H F, Cao D P 2016 Nanotechnology 27 075203
- [18] Lee Y, Lee T, Jang W, Soon A 2016 Chem. Mater. 28 4528
- [19] Yoshio S, Adachi K 2018 Mater. Res. Express 6 026548
- [20] Xu Q Y, Xiao L H, Ran J Y, Tursun R, Zhou G D, Deng L L, Tang D S, Shu Q W, Qin J Y, Lu G S, Peng P 2018 J. Appl. Phys. 124 193102
- [21] McColm I J, Steadman R, Wilson S J 1978 J. Solid State Chem. 23 33
- [22] Gao T, Jelle B P 2013 J. Phys. Chem. C 117 13753
- [23] Segall M D, Lindan P J D, Probert M J, Pickard C J, Hasnip P J, Clark S J, Payne M C 2002 J. Phys. Condens. Matter. 14 2717
- [24] Perdew J P, Chevary J A, Vosko S H, Jackson K A, PedersonM R, Singh D J, Fiolhais C 1992 Phys. Rev. B 46 6671
- [25] Perdew J P, Burke K, Ernzerhof M 1996 Phys. Rev. Lett. 77 3865
- [26] He Y, Wu Z, Fu L, Li C, Miao Y, Cao L, Fan H, Zou B 2003 Chem. Mater. 15 4039
- [27] Bechinger C, Wirth E, Leiderer P 1996 Appl. Phys. Lett. 68 2834
- [28] Barton D G, Shtein M, Wilson R D, Soled S L, Iglesia E 1999 J. Phys. Chem. B 103 630
- [29] Gonzalez-Borrero P P, Sato F, Medina A N, Baesso M L, Bento A C, Baldissera G, Persson C, Niklasson G A, Granqvist C G, Ferreira da Silva A 2010 Appl. Phys. Lett. 96 061909
- [30] Liu J X, Ando Y, Dong X L, Shi F, Yin S, Adachi K, Chonan T, Tanaka A, Sato T, 2010 J. Solid State Chem. 183 2456
- [31] Dostal A, Kauschka G, Reddy S J, Scholz F 1996 J. Electroanal. Chem. 406 155
- [32] Gerand B, Novogorocki G, Guenot J, Figlarz M, 1979 J. Solid State Chem. 29 429
- [33] Migas D B, Shaposhnikov V L, Rodin V N, Borisenko V E 2010 J. Appl. Phys. 108 093713
- [34] Xu J R, Wang Y, Zhu X F, Li P, Zhang L 2012 Acta Phys. Sin. 61 207103 (in Chinese) [徐金荣, 王影, 朱兴凤, 李平, 张莉 2012 物理学报 61 207103]
- [35] Zhou S W, Peng P, Chen W Q, Yu M, H, Guo H, Yuan Z
 2019 Acta Phys. Sin. 68 037101 (in Chinese) [周诗文, 彭平, 陈
 文钦, 庾名槐, 郭惠, 袁珍 2019 物理学报 68 037101]
- [36] Granqvist C G 2012 Sol. Energy Mater. Sol. Cells 99 1
- [37]~ Kamal H, Akl A A, Abdel-Hady K 2004 $Physica \; B \; \mathbf{349} \; 192$
- [38] Shen X C 1992 Optical Property of Semiconductor (Beijing: Science Press) p24 (in Chinese) [沈学础 1992 半导体光学性质 (北京: 科学出版社) 第 24 页]
- [39] Chu J H 2005 Physics of Narrow Gap Semiconductors (Beijing: Science Press) (in Chinese) [褚君浩 2005 窄禁带半导 体物理学 (北京: 科学出版社) 第 165 页]
- [40] Guo C S, Yin S, Huang L J, Yang L, Sato T 2011 Chem. Commun. 47 8853

First-principles investigation on electronic structure and solar radiation shielding performance of Tl_{0.33}WO₃^{*}

Qin Jing-Yun¹⁾ Shu Qun-Wei¹⁾ Yuan Yi¹⁾ Qiu Wei¹⁾ Xiao Li-Hua^{1)†} Peng Ping²⁾ Lu Guo-Song¹⁾

1) (Guizhou Institute of Technology, Guiyang 550003, China)

2) (College of Materials Science and Engineering, Hunan University, Changsha 410082, China)
 (Received 16 October 2019; revised manuscript received 16 December 2019)

Abstract

With energy-saving and emission-reduction have become the theme of today's social development, the theoretical design and research of novel transparent heat insulation materials for windows, which can save energy and improve the comprehensive utilization efficiency of solar energy, are particularly crucial.

In this paper, a calculation method based on DFT(density functional theory) is used to study the lattice parameters (the geometric structure of h-WO₃ crystal was optimized by calculation) electronic band structure, formation energy, and optical properties of pure hexagonal phase tungsten trioxide(h-WO₃) before and after doping with Tl. The calculated results indicate that the lattice volume increases and the total system energy decreases to a negative value after Tl-doped h-WO₃, while the system has better stability; The electron band structure changes greatly after doping, but the material still maintains n-type conductivity. In the meantime, the optical properties of the material also changed, h-WO₃ had no near-infrared absorption performance before Tl-doping, and Tl_{0.33}WO₃ after Tl-doped had strong near-infrared absorption performance. On this basis, the solar radiation shielding performance of h-WO₃ before and after Tl doping has been studied. The results show that pure h-WO₃ has no solar radiation shielding performance, while Tl_{0.33}WO₃ thin films after Tl-doped h-WO₃ have high transparency in visible light region and strong absorption in near infrared radiation. The calculation results provide a theoretical basis for the application of transparent thermal insulating material for windows of Tl-doped h-WO₃.

Keywords: first-principles, Tl-doped, h-WO₃, optical properties

PACS: 71.15.Mb, 78.20.Ci, 78.30.-j, 78.40.-q

DOI: 10.7498/aps.69.20191577

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 61751501, 51776046), the Science and Technology Planning Project of Guizhou Province, China (Grant Nos. [2019]1133, [2019]2830), the Youth Science and Technology Talent Growth Project of Guizhou Provincial Department of Education, China (Grant No. [2018]250), and the National Innovation and Entrepreneurship Training Program for College Students of China (Grant No. 201714440023).

[†] Corresponding author. E-mail: xiaolihua@git.edu.cn